
**Перечень статей, опубликованных в журнале
«ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ»
в 2022 г.**

Средства измерений

- Алексеев В.А., Юран С.И., Усольцев В.П., Шульмин Д.Н.* Система устранения аварийных сбросов в сточные воды предприятий с использованием относительного описания сигналов (in English) 2
- Горбаченя К.Н., Ясюкевич А.С., Кисель В.Э., Толстик Н.А., Тараченко А.А., Гоман В.И., Павловский Л.К., Орлович В.А., Волкова Е.А., Япаскурт В.О., Кулешов Н.В.* Кристалл $\text{Er}^{3+}, \text{Yb}^{3+}:\text{YGDsSiO}_5$ для лазеров спектрального диапазона 1,5–1,6 мкм 1
- Евчик В.Е., Спиридонов А.А., Ушаков Д.В., Саечников В.А.* Разработка и использование инженерных моделей наноспутников для обучения (in English) 3
- Загороднюк А.А., Сеньковский К.Г., Лукашевич Р.В.* Коррекция вклада рассеянного фотонного излучения в показания ионизационной камеры при оценке качества рентгеновского излучения (in English) 3
- Канафьев О.Д., Труханов А.В., Зубарь Т.И., Грабчиков С.С., Панасюк М.И., Котельникова А.Н., Федькин В.А., Федосюк В.М.* Влияние габаритных параметров цилиндрического экрана на эффективность экранирования (in English) 2
- Кисель В.Э.* Компактный лазер на основе кристалла $\text{Tm:KY}(\text{WO}_4)_2$, работающий в режиме пассивной модуляции (in English) 1
- Князев М.А.* Формирование доменной структуры в проектировании открытых информационно-измерительных систем 4
- Курганович А.М., Стасилович В.А., Шишкин И.П., Шкадаревич А.П.* Стендовое оборудование и методики испытаний современных оптических прицелов (in English) 3
- Мухуров Н.И., Ходин А.А., Ким Ёнг-Джун* Приборы и методы измерений запылённости окружающей воздушной среды. Краткий обзор (in English) 1
- Поклонский Н.А., Аникеев И.И., Вырко С.А.* Высокочастотный конденсатор с рабочим веществом «изолятор – нелегированный кремний – изолятор» (in English) 4
- Сафина И.А., Артемьева С.А.* Прогнозирование динамических характеристик терморпар с тонкопроволочными чувствительными элементами (in English) 2
- Фираго В.А., Левкович Н.В., Шулико К.И.* Спектрофотометры диффузного отражения на основе мини-спектрометров C12880MA и C11708MA Hamamatsu (in English) 2

Методы измерений, контроля, диагностики

- Баев А.Р., Асадчая М.В., Майоров А.Л., Сергеева О.С., Деленковский Н.В. **Возможности использования амплитудно-угловых характеристик поверхностных и подповерхностных волн для контроля материалов с поверхностно упрочнённым неоднородным слоем** (in English) 4
- Богдан П.С., Зайцева Е.Г., Баранов П.О., Степаненко А.И. **Анализ распределения освещённости, генерируемой светодиодами матрицами** (in English) 1
- Бусько В.Н., Крень А.П., Ланцман Г.А. **Неразрушающий контроль качества термообработки стальных образцов, полученных аддитивной технологией, магнитошумовым методом** 3
- Жевняк О.Г., Борздов В.М., Борздов А.В., Петлицкий А.Н. **Моделирование электрофизических параметров элементов флеш-памяти методом Монте-Карло** (in English) 4
- Исаев А.В., Суходолов Ю.В., Балахонов Д.В. **Оценка состояния электрических машин на основе математического моделирования дефектообразования в обмотках** 4
- Лапицкая В.А., Кузнецова Т.А., Чижик С.А., Вархолински Б. **Способы повышения точности определения вязкости разрушения твёрдых хрупких материалов при индентировании** (in English) 1
- Муравьёв В.В., Гуцина Л.В. **Структуроскопия витков пружин после высокотемпературной механической обработки на основе измерения скорости рэлеевских волн** 2
- Нестеров В.Н. **Концепция векторных многокомпонентных физических величин, модели и метод измерения** (in English) 4
- Пантелеев К.В., Микитевич В.А., Свистун А.И., Воробей Р.И., Гусев О.К., Жарин А.Л. **Зарядочувствительный метод исследования деформационных процессов** 4
- Петкевич М.Н., Титович Е.В. **Оценка продолжительности сеанса лучевой терапии на этапе предлучевой подготовки** (in English) 1
- Романчак В.М., Серенков П.С. **Модель измерения неаддитивной величины** (in English) 3
- Савкова Е.Н., Гундина М.А. **Тензорное исчисление в цифровой колориметрии** (in English) 3
- Сандомирский С.Г., Валько А.Л., Руденко С.П. **Расчёт поправочных коэффициентов при измерении твёрдости по Виккерсу на неплоской поверхности** (in English) 3
- Сандуляк А.А., Сандуляк Д.А., Горпиненко Ю.О., Сандуляк А.В., Ершова В.А. **Подход к контролю магнитных параметров сердцевин цепочки шаров. Диагностика разных по длине цепочки и радиусу сердцевин** (in English) 2
- Солодуха В.А., Пилипенко В.А., Омельченко А.А., Шестовский Д.В. **Спектральная эллипсометрия как метод изучения влияния быстрой термообработки кремниевых пластин на их оптические характеристики** (in English) 3
- Суходолов Ю.В., Исаев А.В., Шейников А.А. **Спектральное представление измерительных одиночных и квазипериодических сигналов** (in English) 2
- Тимофеев А.М. **Вероятность ошибочной регистрации данных в однофотонном канале связи стирающего типа с приёмником на основе счётчика фотонов** (in English) 2
- Фёдорцев Р.В., Метельская Е.А., Марчик В.А., Кузнецов А.В., Макаревич А.Е. **Метод повышения эффективности технологического процесса склейки линз и достоверная оценка выходных контролируемых параметров** (in English) 1
- Хрущинский Аркадий, Кутень Семен, Жуковский Александр, Шугай Наоюки, Шугай Хироши, Мого Мичинори **Определение содержания ^{238}U по гамма-излучению $^{234\text{m}}\text{Pa}$** (in English) 1